

Fumis. Chih-Chien et al. June 24, 2007

විති විති විති වර්

# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 02 月 14 日

Application Date

申 請 案 號: 092103122

Application No.

申 請 人: 財團法人工業技術研究院

Applicant(s)

局 Director General



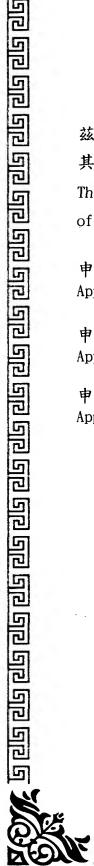
發文日期: 西元 <u>2003</u> 年 <u>4</u> 月 <u>1</u> 日

Issue Date

發文字號:

09220318400

Serial No.





申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書							
	中文	光學儲存媒體之軌誤差訊號偵測電路					
發明名稱	英 文	Circuit For Tracking Error Signal Detection on An Optical Storage Medium					
		1. 黄志堅 2. 鄭裕 3. 曾乃恆					
=	(英文)	1. Chih-Chien HUANG 2. Yah CHENG 3. Nai-Heng TSENG					
發明人 (共3人)	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW 3. 中華民國 TW					
()(0) =)	住居所(中文)	1. 雲林縣四湖鄉廣溝村115號 2. 新竹縣北市嘉興路2384巷11號6樓 3. 新竹市東區長春街158巷1弄12號4樓					
	住居所(英文)	1. 2. 3.					
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 財團法人工業技術研究院					
	名稱或 姓 名 (英文)	1. INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE					
三、	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW					
申請人(共1人)	住居所(營業所)	1. 新竹縣竹東鎮中興路四段195號 (本地址與前向貴局申請者不同)					
	住居所(營業所)	C					
	代表人(中文)	1. 翁政義					
	代表人 (英文)	1. Cheng-I WENG					





## 四、中文發明摘要 (發明名稱:光學儲存媒體之軌誤差訊號偵測電路)

一種光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路,包括有複數個數位化單元、複數個邏輯比較單元以及一差動放大器,係分別將欲進行比較相位的訊號相加所得的訊號, 利用一延遲單元據以取得一延遲訊號,俾以藉由該延遲訊號偵測等訊號之相位差並藉以取得該光學記錄媒體之軌誤差訊號。

伍、(一)、本案代表圖為:第\_8\_圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

31電 容

32訊號切割單元

1-

33電 阻

35電 阻

36電 容

37電 阻

38電 阻

39差 動 放 大 器

41電 容

42訊號切割單元

43電 阻

45電 阻

46電 容

47電 阻

六、英文發明摘要 (發明名稱:Circuit For Tracking Error Signal Detection on An Optical Storage Medium)



## 四、中文發明摘要 (發明名稱:光學儲存媒體之軌誤差訊號偵測電路)

- 48電阻 51加法器
- 52訊號切割單元
- 53延 遲 單 元
- 61邏輯比較單元
- 62邏輯比較單元
- E1第一合成訊號
- E2第二合成訊號
- E3第三合成訊號
- TE軌誤差訊號
- 11第一數位合成訊號
- S12第二數位合成訊號
- S13第三數位合成訊號
- S13d延 遲 訊 號
- A11第一比較訊號
- B11第二比較訊號

六、英文發明摘要 (發明名稱:Circuit For Tracking Error Signal Detection on An Optical Storage Medium)



,			
一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		無	
	·		
- □土涯 声划斗 符 -	してなみ 笠 石/	百斗劫。	
二、□主張專利法第二	十五條之一弟一項作	変九權:	
申請案號:		無	
日期:		<del>////</del>	
三、主張本案係符合專	利法第二十條第一	項□第一款但書:	或□第二款但書規定之期間
日期:			
   四、□有關微生物已寄	存於國外:		
寄存國家:		/	
寄存機構:		無	
寄存日期:			
寄存號碼:			
	存於國內(本局所指	定之寄存機構)	:
寄存機構:		無	
寄存日期:		7111	
寄存號碼:	·易於獲得,不須寄存	<del>.</del> 0	
1 数自磁势权侧名	このこれにカマイヤモ、ノアクス・ディイン	7 -	



## 五、發明說明(1)

## 【發明所屬之技術領域】

本發明係關於一種訊號的偵測與取得方法,特別是一種關於光學記錄媒體之軌誤差訊號的取得方法。

## 【先前技術】

目前利用光學讀取頭在跨軌時,不同位置光感測器道的訊號會有相位差來判斷所在之軌道位置。在高密度的光學記錄媒體上,美國第6137755號專利(專利名稱:

Deriving a tracking error signal from a time difference between detector signals).,提出一種電路取得軌誤差訊號,增加訊號的可靠度。其電路圖如『第1圖』所示,一第一合成訊號(summing signal) F1經由電容 11輸入至一訊號切割單元(slicer) 12之輸入端,輸入端同時耦接有一電阻 13至接地端,以產生適當的電壓切割準位。訊號切割單元 12之輸出訊號 S1經由一邏輯比較單元(EXOR) 14之第一輸入端輸入,其輸出訊號 A再經由一由電阻 15與電容 16所組成的低通濾波器處理後,再經由電阻 17輸入至一差動放大器 18之負輸入端,差動放大器 18之負輸入端所輸出之訊號即為軌誤差訊號 TE(Tracking Error),並經由電阻 19迴授至差動放大器 18之負輸入端。第二合成訊號 F2同樣經過與上述相對應之元件,亦即

端。第二合成訊號 F2同樣經過與上述相對應之元件,亦即電容 21、訊號切割單元 22、電阻 23、邏輯比較單元 24、電阻 25與電容 26所組成之低通濾波器、以及電阻 27,而輸入至差動放大器 18之正輸入端。差動放大器 18之正輸入端則 耦接有一電阻 28。其中,更包括有一延遲單元 20用以取得





## 五、發明說明 (2)

一延遲訊號 S1d,並分別輸入至邏輯比較單元 14以及邏輯比較單元 24之第二輸入端。

第 6137755號專利所使用以第一合成訊號 DI以取得延遲訊號 SId以取得相位誤差 (phase error)之架構與方法存在一個問題,亦即在取得此延遲訊號 SId時需注意最高頻的訊號 (假設為 3T),其示意圖如『第 2圖』所示,當延遲訊號 SId取得太小或太大,訊號偵測會有問題,延遲訊號 SId的範圍限制在 Tp< SId <3T-Tp。

延遲訊號 S1d所取延遲的值理論上越大越好,因為越大的訊號,其用來取得相位差 (phase difference)的訊號脈衝寬度越寬,在此前提之下,其相位比較電路較易完成。假設所取的訊號延遲量為 3T-Tp, 可知相位比較器個輸出的脈衝寬度為 3T-2Tp。當資料密度提高或讀取速度上升導致訊號頻率升高時,這個訊號的頻率就很難處理。

綜上所述,第 6137755號專利所揭露的方法存在改進之空間,因為使用其中的某單一訊號作延遲來取出訊號的領先與落後,以使得該延遲量的可靠範圍縮小。

## 【發明內容】

鑒於以上的問題,本發明的主要目的在於提供一種光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路,藉以提高軌誤差訊號的可靠度。

因此,為達上述目的,本發明所揭露之光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路之第一實施例,係根據一第一合成訊號與一第二合成訊號之相位差產生一軌誤差訊號,包





## 五、發明說明 (3)



## 五、發明說明 (4)

訊號、該第二延遲訊號與該第四數位訊號,並分別輸出第一比較訊號、第二比較訊號、一第三比較訊號、一第四比較訊號;以及一差動放大器,根據該第一比較訊號、該第二比較訊號、該第二比較訊號、該第二比較訊號、該第四比較訊號以輸出該軌誤差訊號。

本發明所揭露之光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電 路之又一實施例,係根據一第一訊號、一第二訊號、一第 三訊號以及一第四訊號之相位差產生一軌誤差訊號, 有複數個數位化單元,用以將該第一訊號、該第二訊號 該 第 三 訊 號 、 該 第 四 訊 號 分 別 輸 出 為 一 第 一 數 位 訊 號 第二數位訊號、一第三數位訊號以及一第四數位訊號,並 根據一合成訊號輸出一數位合成訊號,其中該合成訊號係 根據該第一訊號、該第二訊號、該第三訊號與該第四訊號 產生;一延遲單元,係根據該數位合成訊號產生一延遲訊 號;複數個邏輯比較單元,用以分別比較該延遲訊號與該 第 一 數 位 訊 號 、 該 延 遲 訊 號 與 該 第 二 數 位 訊 號 、 該 延 遲 訊 號與該第三數位訊號、該延遲訊號與該第四數位訊號,並 分别輸出第一比較訊號、第二比較訊號、一第三比較訊 號、一第四比較訊號;以及一差動放大器,根據該第一比 較 訊 號 、 該 第 二 比 較 訊 號 、 該 第 三 比 較 訊 號 、 該 第 四 比 較 訊號以輸出該軌誤差訊號

本發明所應用之光碟系統中,光學讀取頭的光感測器 (Photo Detector, PD)可分為 A、B、C、D四個區域。當 光學讀取頭在跨軌時,光感測器上區域 A、區域 B、區域





## 五、發明說明 (5)

C、區域 D所感應的訊號會有領先與落後發生,因此,由區域 A與區域 B所感應到的訊號的相位差,即可判斷軌道的位置。首先將區域 A與區域 B所感測到的訊號數位化後取一個延區域 A與區域 B所感測到的訊號加總後再數位化後取一個延遲訊號 (延遲時間為 Td),利用這個訊號將區域 A與區域 B所感測到的數位化訊號的相位比較出來,所得的訊號經過所感測到的數位化訊號的相位比較出來,所得的訊號經過低通濾波器後,其軌誤差訊號的品質較不受 Td延遲時間長短的影響。

以下就本發明所揭露的光學儲存媒體鎖軌訊號的取得方法與習知技術作一比較,以凸顯本案之進步性以及與前案之差異性。

本發明所揭露的方法,將兩個欲進行比較相位的類比訊號相加,再數位化之後,取延遲以取得兩個訊號的相位差。當在軌道邊緣,有些訊號會比較弱,甚至無法超過切成難強。在軌道邊緣,有些訊號會比較弱,甚至無法超過切成準就會有相位領先 180度或落後 180度的情形發生,然而這種情況是錯誤的,在第 6137755號專利中所揭露的電路中會發生。採用本發明所揭露的方法,將兩個類比訊號相加再取數位化,就可以改善這種情形,其範圍變成 Tp/2<延遲訊號</td>





## 五、發明說明 (6)

6137755號專利高,頻率較低,電路也比較容易製作。與前案相較,如果欲產生的訊號不要有太高頻的訊號,則必須將延遲控制得很好,否則跨軌訊號會受到延遲的影響。根據本發明所揭露的方法,其延遲的範圍為 Tp/2<延遲〈3T-Tp/2,且延遲越小越好,當延遲為 Tp/2時,相位比較器輸出的最短脈衝寬度為 3T-Tp, 此脈衝寬度比美國第6137755號專利中為高,所需的比較器頻寬較低。且延遲的控制變得比較簡單,僅需確定其是否大於 Tp/2即可,不用考慮 3T的影響,就能達到降低訊號頻率的效果。

綜上所述,本發明所揭露的方法,具有以下的優點, 第一增加延遲訊號可以使用的範圍,第二,簡化延遲控制 的機制,第三,降低相位比較器所需要的頻寬。第四,提 高跨軌訊號的可靠度。

根據本發明所揭露的方法,可以將延遲的範圍擴大,使得鎖軌訊號對於延遲的依賴性下降,並簡化延遲的控制。因此,在光學記錄媒體的資料密度與讀取速度提高的情況下,可得到穩定的跨軌訊號。

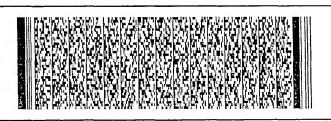
有關本發明的特徵與實作,茲配合圖示作最佳實施例詳細說明如下。

## 【實施方式】

本發明所應用之光碟系統中,光學讀取頭的光感測器(Photo Detector, PD)可分為區域 A、區域 B、區域 C、區域 D四塊,以及兩個軸向,分別為切線方向

(tangential)以及徑向方向(radial),如『第3圖』





#### 五、發明說明 (7)

所示。當光學讀取頭在跨軌時,光感測器上A、B、C、D所感應的訊號 SA、SB、SC以及 SD會有領先與落後發生,因此,由 A與 B所感應到的第一訊號 SA與第二訊號 SB的相位差,可以判斷軌道的位置。首先將區域 A與區域 B的第一訊號 SA與第二訊號 SB數位化後,並將類比型式的訊號 SA+SB也數位化後取一個延遲量(Td)得到一延遲訊號,利用這個延遲訊號將第一訊號 SA與第二訊號 SB的相位比較出來,所得的訊號經過低通濾波器後,其軌誤差訊號的品質較不受 Td延遲時間長短的影響。

當跨軌的時候,也就是『第 3圖』中 radial方向,光感測器所感測光會有相位(或時間)的領先與落後,當雷射光偏軌道左邊的時候(X>0),第一訊號 SA的相位比第二訊號 SB的相位領先,第三訊號 SC的相位比第四訊號 SD的相位領先,當雷射光偏軌道右邊的時候(X<0),第二訊號 SB的相位比第一訊號 SA的相位領先,第四訊號 SD的相位比第三訊號 SC的相位領先,第四訊號 SD的相位比第三訊號 SC的相位領先,第四訊號 SD的相位比第三訊號 SC的相位領先,因此可以用 DTD2:  $TE=[\phi(A+C)]-[\phi(B+D)]$ ,也可以用 DTD4:  $TE=[\phi(A)-\phi(B)]+[\phi(C)-\phi(D)]$ 來判別軌訊號。

本發明所揭露之光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路請參考『第4圖』,係利用 DTD2:  $TE=[\phi(A+C)]-[\phi(B+D)]$ 之方法取得軌誤差訊號 TE,第一合成訊號 E1 ( = SA+SC,為第一訊號 SA與第三訊號 SC之合)經由電容 31輸入至一訊號切割單元 32之輸入端,輸入端同時耦接有一電阻 33至接地端,以產生適當的電壓切割準位。訊號切





## 五、發明說明 (8)

割單元 32、電容 31與電阻 32組成一數位化單元,係用以將第一合成訊號 E1數位化,以下所使用之訊號切割單元、電容與電阻之用途與此實施例相同,不再另行說明。

訊號切割單元 32之所輸出之第一數位合成訊號 S11經由一邏輯比較單元 (EXOR) 34之第一輸入端輸入,其輸出之第一時訊號 A1再經由一由電阻 35與電容 36所組成的低通滤波器處理後,再經由電阻 37輸入至一差動放大器 39之負輸入端,差動放大器 39之輸出端所輸出之訊號即為軌誤差訊號 TE(Tracking Error)。軌誤差訊號 TE再經由電阻 38迴授至差動放大器 39之負輸入端。第二合成訊號 E2 (= SB+SD,為第二訊號 SB與第四訊號 SD之合)同樣經過與上述相對應之元件,亦即經過電容 41、訊號切割單元42、電阻 43後輸出一第二數位合成訊號 S12,接著輸入至 選輯比較單元 44後輸出一第二比較訊號 B1,最後經由電阻 45與電容 46所組成之低通滤波器、以及電阻 77,而輸入至差動放大器 39之正輸入端。差動放大器 39之正輸入端接有一電阻 48至接地端。

其中,更包括有加法器 51將第一合成訊號 E1與第二合成訊號 E2加總,以得到一第三合成訊號 E3, E3= E1+E2,再經由訊號切割單元 52後輸出一第三數位合成訊號 S13。接著,再將第三數位合成訊號 S13輸入至一延遲單元 53以取得一延遲訊號 S13d,並分別輸入至邏輯比較單元 34以及邏輯比較單元 44之第二輸入端。其中,延遲單元所產生之延遲訊號僅與第三數位合成訊號 S13相關,與其他數位合





#### 五、發明說明 (9)

成訊號無關。延遲訊號 S13d經由邏輯比較單元 34、44與第一比較訊號 A1與第二比較訊號 B1即可得知 S11與 S12的相位差。

本發明所揭露的方法,因為所使用的比較訊號為經由兩個訊號共同產生,因此所產生之信號的穩定度較美國第6137755號專利中所揭露的方法為高。又相位比較器輸出的最短脈衝寬度為 3T-Tp,此脈衝寬度也較美國第 6137755號專利高,頻率較低,所以電路也比較容易製作。與前案相較,如果欲產生的訊號不要有太高頻的訊號,則必須將延遲控制得很好,否則跨軌訊號會受到延遲的影響,如『第 5圖』所示,其延遲的範圍為 Tp/2<延遲〈3T-Tp/2,且延遲越小越好,當延遲為 Tp/2時,光感測器其中一個輸出的最短脈衝寬度為 3T-Tp,此脈衝寬度比美國第 6137755號專利中為高。且延遲的控制變得比較簡單,僅需確定其是否大於 Tp/2即可,不用考慮 3T的影響,就能達到降低訊號頻率的效果。

『第 6圖』所示為『第 4圖』所示之電路在操作時, x> 0時之相位差,第一合成訊號 E1、第二合成訊號 E2與第三合成訊號 E3為類似正弦波之訊號波形,其數位化後之波形為如 S11、 S12及 S13所示,第三數位合成訊號訊號 S13經過延遲 元後之波形如延遲訊號 S13d所示,其延遲之時間為 Td,第一合成訊號 E1與第二合成訊號 E2的相位差為  $\Delta$  ,同樣為第一數位合成訊號 S11與第二數位合成訊號 S12的相位差,第一比較訊號  $\Delta$  511與延遲訊號





## 五、發明說明 (10)

S13d經過 EXOR運算後而得,而第二比較訊號 B1為第二數位,合成訊號 S12與延遲訊號 S13d經過 EXOR運算後而得。因此,在 x>0時,訊號 A1減訊號 B1之相位差  $\Delta$  係為一正脈衝,恰好與第一數位合成訊號 S11與第二數位合成訊號 S12之相位差相同。 x<0時之相位差如『第7圖』所示,第一合成訊號 E1係領先第二合成訊號 E2,因此,在 x<0時,第一比較訊號 A1減第二比較訊號 B1之相位差  $\Delta$  係為一負脈衝,恰好與第一數位合成訊號 S11與第二數位合成訊號 S12之相位差相同。

續請參考『第8圖』,為本發明之第二較佳實施例。 與第一實施例不同的是,係在延遲訊號 S13d為高準位 (HIGH)的時候,直接比較第一數位合成訊號 S11與第二 數位合成訊號 S12。第一比較訊號 A11係利用邏輯比較單元 61將第一數位合成訊號 S11與延遲訊號 S13d作 AND運算得來,第二比較訊號 B11係利用邏輯比較單元 62將第二數位合成訊號 S12與延遲訊號 S13d作 AND運算得來,使用 AND作為邏輯比較單元的目的是要利用延遲訊號 S13d來決定 S11 與 S12是否要比較的開關,當 S13d為 High時,即送出 A11與 B11,並透過差動放大器 39比較,直接比較 A11與 B11,再 通過低通率波器取出軌誤差訊號。

『第 9圖』所示為『第 8圖』所示之電路在操作時, x> 0時之相位差,第一合成訊號 E1、第二合成訊號 E2與第三合成訊號 E3為類似正弦波之訊號波形,其數位化後之波形為如 S11、S12及 S13所示,第三數位合成訊號 S13經過延遲





## 五、發明說明 (11)

單元後之波形如訊號 S13d所示,其延遲之時間為 Td,第一合成訊號 E1與第二合成訊號 E2的相位差為  $\Delta$  ,同樣為訊號 S11與訊號 S12的相位差,第一比較訊號 A11為第一數位合成訊號 S11與延遲訊號 S13d經過 AND運算後而得,而第二比較訊號 B1為第二數位合成訊號 S12與延遲訊號 S13d經過 AND運算後而得。因此,在 x>0時,第一比較訊號 A11減第二比較訊號 B11之相位差  $\Delta$  係為一正脈衝,恰好與第一數位合成訊號 S11與第二數位合成訊號 S12之相位差  $\Delta$  相同。 x<0時之相位差如『第 10圖』所示,第一合成訊號 E1係領先第二合成訊號 E2,因此,在 x<0時,第一比較訊號 A11減第二比較訊號 B11之相位差  $\Delta$  係為一 負脈衝,恰好與第一數位合成訊號 B11

續請參考『第 11圖』,為本發明所揭露之方法利用DTD4: TE=[φ (A)-φ (B)]+[φ (C)-φ (D)]之方法取得軌誤差號 TE,第一訊號 SA經由電容 71輸入至一訊號切割單元 72之輸入端,輸入端同時耦接有一電阻 73至接地端,以產生適當的電壓切割準位。訊號切割單元 72之輸出第一數位訊號 SAI經由一邏輯比較單元 (AND) 74之第一輸入端輸入,其輸出之第一比較訊號 A2再經由一由電阻 75與電容 76所組成的低通濾波器處理後,再經由電阻 77輸入至一差動放大器 78之正輸入端,差動放大器 78之正輸入端則耦接有一電阻 79至接地端。差動放大器 78之輸出端所輸出之訊號即為執誤差訊號 TE(Tracking Error)。軌誤差訊號 TE再經由電阻 80迴接至差動放大器 78之負輸入端。第二訊號 SB同樣經





#### 五、發明說明(12)

過與上述相對應之元件,亦即經過電容 81、訊號切割單元 82、電阻 83後輸出第二數位訊號 SB1,接著輸入至邏輯比較單元 81後輸出一第二比較訊號 B2,最後經由電阻 85與電容 86所組成之低通濾波器、以及電阻 87,而輸入至差動放大器 78之負輸入端。

其中,更包括有加法器 88將訊號 SA與訊號 SB加總,以得到一第一合成訊號 SAB, SAB= SA+SB,再經由訊號切割單元 89後輸出一第一數位合成訊號 SAB1。接著,再將第一數位合成訊號 SAB1輸入至一延遲單元 90以取得一第一延遲訊號 SAB1d,並分別輸入至邏輯比較單元 74以及邏輯比較單元 84之第二輸入端。

訊號 SC經由電容 91輸入至一訊號切割單元 92之輸入 端,輸入端同時耦接有一電阻 93至接地端,以產生適當的 電壓切割準位。訊號切割單元 92之輸出第三數位訊號 SC1 經由一邏輯比較單元 (AND) 94之第一輸入端輸入,其輸 出之第三比較訊號 C2再經由一由電阻 95與電容 96所組成的 低通濾波器處理後,再經由電阻 97輸入至一差動放大器 78 之負輸入端。第四訊號 SD同樣經過與上述相對應之元件, 亦即經過電容 101、訊號切割單元 102、電阻 103後輸出第 四數位訊號 SD1,接著輸入至邏輯比較單元 104後輸出一第 四比較訊號 D2,最後經由電阻 105與電容 106所組成之低通 濾波器、以及電阻 107,而輸入至差動放大器 78之負輸入 端。

其中, 更包括有加法器 108將第三訊號 SC與第四訊號





#### 五、發明說明(13)

SD加總,以得到一第二合成訊號 SCD, SCD= SC+SD, 再經由訊號切割。單元後輸出一第二數位合成訊號 SCD1。接著, 再將訊號 SCD1輸入至一延遲單元 110以取得一第二延遲訊號 SCD1d, 並分別輸入至邏輯比較單元 94以及邏輯比較單元 104之第二輸入端。

差動放大器 78之正輸入端之來源為第一訊號 SA與第三訊號 SC,負輸入端之來源為第二訊號 SB與第四訊號 SD。因此,所輸出之軌誤差訊號 TE即如公式 DTD4中所表示。

綜上所述,本發明所揭露的方法,具有以下的優點,第一、增加延遲訊號可以使用的範圍,第二、簡化延遲控制的機制,第三降低相位比較器所需要的頻寬。第四,提高跨軌訊號的可靠度。

雖然本發明以前述之較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習相像技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,因此本發明之專利保護範圍須視本說明書所附之申請專利範圍所界定





五、發明說明(14) 者為準。



#### 圖式簡單說明

- 第1圖,係為習知之取得軌誤差訊號之電路方塊圖;
- 第2圖,係為習知之延遲訊號示意圖;
- 第3圖,係為光感測器之示意圖;
- 第4圖,係為本發明之取得軌誤差訊號之電路方塊圖,係
- 使 用 DTD2方 法 ;
- 第5圖,係為本發明之延遲訊號示意圖;
- 第 6圖 ,係為使用 DTD2方法時,當 x>0時之訊號時序圖;
- 第 7圖 ,係為使用 DTD2方法時,當 x<0時之訊號時序圖;
- 第8圖,係為本發明之取得軌誤差訊號之第二較佳實施例之電路方塊圖;
- 第 9圖 ,係為第二較佳實施例使用 DTD2方法時,當 x>0時之 訊號時序圖;
- 第 10 圆 , 係 為 第 二 較 佳 實 施 例 使 用 DTD2 方 法 時 , 當 x<0 時 之 訊 號 時 序 圖 ;
- 第 11圖,係為本發明之取得軌誤差訊號之之第三較佳實施例之電路方塊圖,係使用 DTD4方法;以及
- 第 1 2 圖 ,係為本發明之取得軌誤差訊號之之第四較佳實施例之電路方塊圖,係使用 DTD 4方法。

## 【圖式符號說明】

- 11 電。容
- 12 訊號切割單元
- 13 電阻
- 14 邏輯比較單元
- 15 電阻



圖式簡單說明						
16	電	容				
17	電	阻				
18	差	動	放	大	器	
19	電	阻	•			
2 0	延	遲	單	元		
21	電	容				
2 2	訊	號	切	割	單	元
2 3	電	阻				
2 4	邏	輯	比	較	單	元
2 5	電	阻				
26	電	容				
27	電	阻				
28	電	阻				
31	電	容				
3 2	訊	號	切	割	單	元
3 3	電	阻				
34	邏	輯	比	較	單	元
3 5	電	阻				
3 6	電	容				
3 7	電	阻				
3 8	電	阻				
3 9	差	動	放	大	器	
41	電	容	-			
42	訊	號	切	割	單	元



圖式簡單說明	月				
43	電阻	-			
4 4	邏輯	比比	較	單	元
45	電阻	L			
46	電容				
47	電阻				
48	電阻				
51	加法				
5 2	訊號			單	元
5 3	延遲			1	_
61	邏車			單	元
6 2	邏彰				
71	電電		· ¬ሌ	-1	, <b>U</b>
72	訊易		宜	留	亓.
73	電門		51	7	/ (1
74	避車		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	留	亓
75			4 书义	干	<i>/</i> L
	電影響			٠	
76	電名				
77	電門		_ 1_	מִס	
78	差重		、大	. 吞	
79	電門				
8 0	電形				
9 1	電力			, ar	
	訊号		了割	單	元
9 3	電用	且			
1					



圖式簡單說明		•				
9 4	邏	輯	比	較	單	元
9 5	電	阻				
96	電	容				
9 7	電	阻				
1 0 1	電	容				
102	訊	號	切	割	單	元
103	電	阻				-
104	邏	輯	比	較	單	元
105	電	阻				
106	電	容				
107	電	阻				
108	加	法	器			
110	延	遲	單	元		
111	加	法	器			
112	訊	號	切	割	單	元
113	延	遲	單	元		
F1	第		合	成	訊	號
F 2	第	=	合	成	訊	號
S1d	延	遲	訊	號		
A	輸	出	訊	號		
В	輸	出	訊	號		
E 1	第		合	成	訊	號
E 2	第		. 合	成	訊	號
E3 .	第	Ξ	. 合	成	訊	號



#### 圖式簡單說明 ΤE 軌誤差訊號 SA 第一訊號 SB第二訊號 SC第三訊號 SD 第四訊號 SA + SB訊號 S11 第一數位合成訊號 S 1 2 第二數位合成訊號 S 1 3 第三數位合成訊號 S13d 延遲訊號 A 1 第一比較訊號 B 1 第二比較訊號 C 1 第三比較訊號 D 1 第四比較訊號 相位差 Δ A 1 1 第一比較訊號 B 1 1 第二比較訊號 SA1 第一數位訊號 SB1 第二數位訊號 第三數位訊號 SC1 SD1 第四數位訊號 SAB 第一合成訊號 SAB1 第一數位合成訊號



第一延遲訊號

SAB1d

## 圖式簡單說明

SCD 第二合成訊號

SCD1 第二數位合成訊號

SCD1d 第二延遲訊號

ST 合成訊號

ST1 數位合成訊號

ST1d 延遲訊號



1.一種光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路,該光學儲存媒體係藉由複數個光感測單元偵測經由碟片反射之光東,以產生複數個不同之訊號,該複數個訊號並係根據產生一第一合成訊號與一第二合成訊號以取得一循軌訊號誤差軌誤差訊號,包括有:

複數個數位化單元,用以將該第一合成訊號、該第二合成訊號輸出為一第一數位合成訊號、一第二數位合成訊號,並根據一第三合成訊號輸出一第三數位合成訊號,其中第三合成訊號係根據該第一合成訊號與該第二合成訊號產生;

一延遲單元,係根據該第三數位合成訊號產生一延遲訊號;以及

複數個邏輯比較單元,用以比較該延遲訊號與該第一數位合成訊號並輸出一第一比較訊號、以及比較該延遲訊號以及該第二數位合成訊號並輸出一第二比較訊號,以根據該第一比較訊號與該第二比較訊號以輸出該循軌訊號誤差。

- 2.如申請專利範圍第 1項所述之光學儲存媒體之循軌訊號 誤差偵測電路,其中該數位化單元更包括有複數個交流 耦合電容、複數個電阻及複數個訊號切割單元,以耦合 各別的該第一合成訊號或該第二合成訊號以產生該第一 數位合成訊號或該第二數位合成訊號。
- 3.如申請專利範圍第 1項所述之光學儲存媒體之循軌訊號 誤差偵測電路,其中該複數個邏輯比較單元係為一 EXOR





邏輯閘。

- 4.如申請專利範圍第 1項所述之光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路,其中該複數個邏輯比較單元係為一 AND 邏輯閘。
- 5.一種光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路循軌訊號誤差偵測電路,該光學儲存媒體係藉由複數個光感測單元偵測經由碟片反射之光束,以產生複數個不同之訊號,該複數個訊號並係根據產生一第一合成訊號與一第二合成訊號以取得一循軌訊號誤差軌誤差訊號,其特徵在於:

將一第一合成訊號以及一第二合成訊號加總以取得一第三合成訊號後,並依據該第三合成訊號數位化後取得一延遲訊號,俾以藉由該延遲訊號根據該第一合成訊號以及該第二合成訊號以取得該軌誤差訊號。

6.一種光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路,該光學儲存媒體係藉由複數個光感測單元偵測經由碟片反射之光東,以產生複數個不同之訊號以取得一循軌訊號誤差軌誤差訊號,該複數個訊號包括有一第一訊號、一第二訊號、一第三訊號以及一第四訊號,包括有:

複數個數位化單元,用以將該第一訊號、該第二訊號、該第三訊號、該第四訊號分別輸出為一第一數位訊號、一第二數位訊號、一第三數位訊號以及一第四數位訊號,並根據一第一合成訊號輸出一第一數位合成訊號,其中該





第一合成訊號係根據該第一訊號與該第二訊號產生,該第二合成訊號係根據該第三訊號與該第四訊號產生;

複數個延遲單元,係分別根據該第一數位合成訊號、該第二數位合成訊號產生一第一延遲訊號、第二延遲訊號;以及

複數個邏輯比較單元,用以分別比較該第一延遲訊號與該第一數位訊號、第一延遲訊號與該第二數位訊號、該第二延遲訊號與該第二與數位訊號、該第二延遲訊號、與該第四數位訊號、,並分別輸出第一比較訊號、第二比較訊號、一第四比較訊號、一第四比較訊號、該第二比較訊號、該第三比較訊號、該第三比較訊號、該第三比較訊號、該第三比較訊號、該第三比較訊號、該第四比較訊號以輸出該軌誤差訊號。

- 7.如申請專利範圍第 6項所述之光學儲存媒體之循軌訊號 誤差偵測電路,其中該數位化單元更包括有複數個交流 耦合電容、複數個電阻及複數個訊號切割單元,用以耦 合各別的該第一訊號、該第二訊號、該第三訊號或該第 四訊號以輸出該第一數位訊號、該第二數位訊號、該第 三數位訊號以及該第四數位訊號。
- 8.如申請專利範圍第 6項所述之光學儲存媒體之循軌訊號 誤差偵測電路,其中該複數個邏輯比較單元係為一 AND 邏輯閘。
- 9.一種光學儲存媒體之循軌訊號誤差偵測電路,該光學儲存媒體係藉由複數個光感測單元偵測經由碟片反射之光東,以產生複數個不同之訊號以取得一循軌訊號誤差軌





誤差訊號,該複數個訊號包括有一第一訊號、一第二訊號、一第三訊號以及一第四訊號,包括有:

複數個數位化單元,用以將該第一訊號、該第二訊號、該第三訊號、該第三訊號分別輸出為一第一數位訊號、一第二數位訊號、一第三數位訊號以及一第四數位訊號,並根據一合成訊號輸出一數位合成訊號,其中該合成訊號係根據該第一訊號、該第二訊號、該第三訊號

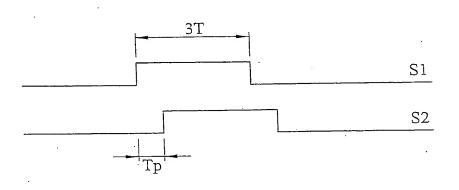
一延遲單元,係根據該數位合成訊號產生一延遲訊號;以及

10.如申請專利範圍第9項所述之光學儲存媒體之循軌訊號

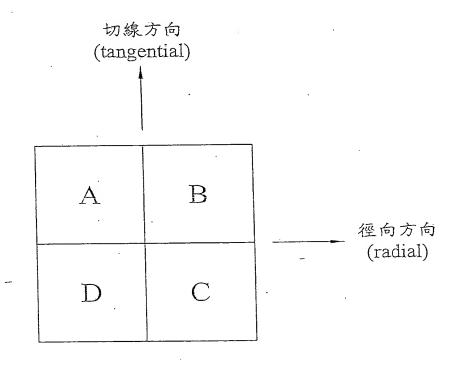


誤差偵測電路,其中該複數個邏輯比較單元係為一 AND 邏輯閘。



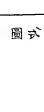


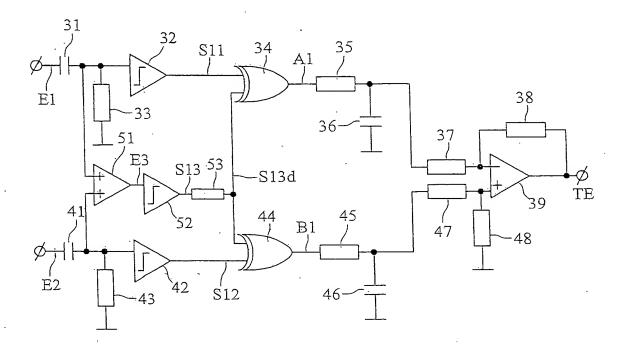
第2圖



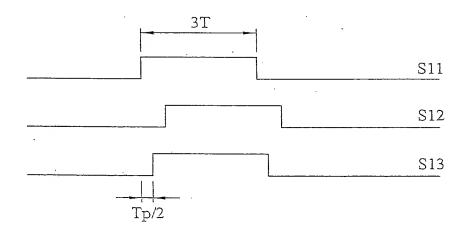
第3圖

等るの真



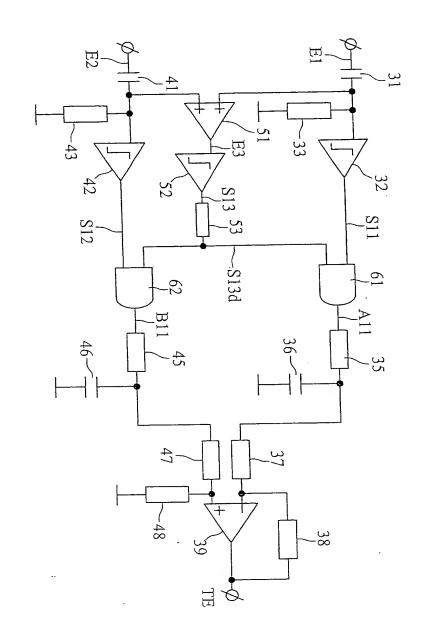


第4圖



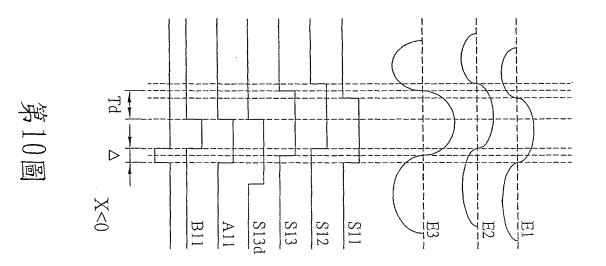
第5圖

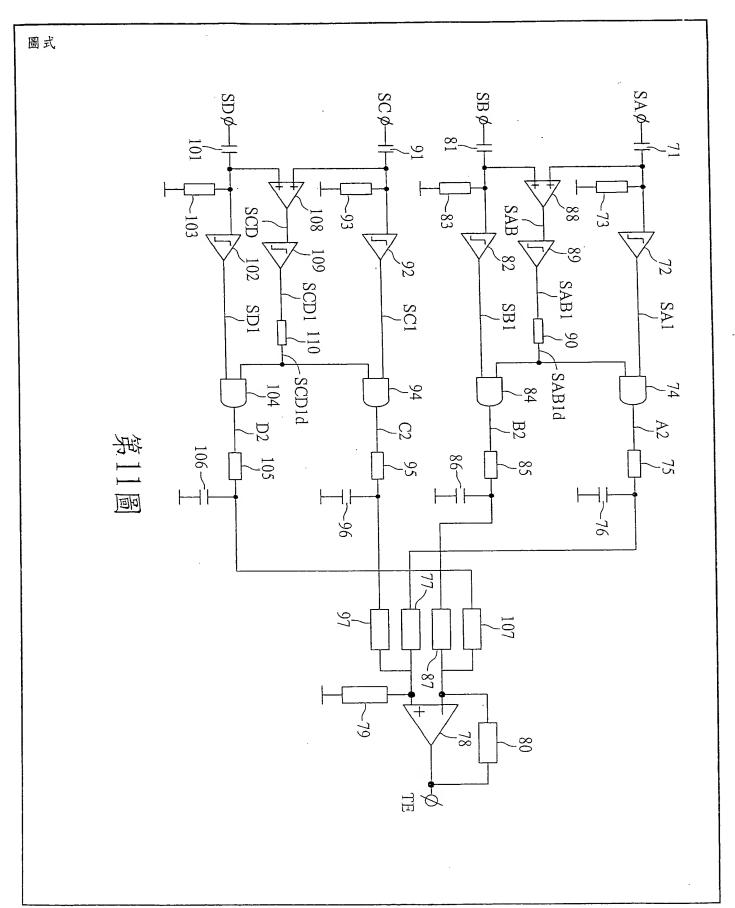
題8辞



第3頃

E2 E2 S11 S11 S12 S13 S13d A11 B11





第り頁

